

平成29年 IEC活動推進会議（APC）議長賞受賞者

電気・電子分野の国際標準化機関であるIEC（国際電気標準会議）の活動は、市場のグローバル化に対応してますます重要性が高まっています。IECへの日本の貢献と産業界の意見反映を目的に平成3年に設立されたIEC活動推進会議（IEC-APC）は、日本提案のIEC分野で顕著な貢献をした個人またはグループを毎年表彰しています。

本年は4名を、平成29年5月29日（月）の第27回IEC活動推進会議総会で表彰しました。



（後列・左から：椎木氏、谷川氏、塚越氏、松山氏）
（前列・左から：平岡執行役員、森田課長、鈴木議長、矢野副議長）

議長賞（敬称略・50音順）

椎木 元晴（株式会社東芝）

IEC/SC 17A/MT 49 (IEC 62271-102)の規格改定作業において、国際貢献と日本の利益を考慮し、積極的に規格立案を行った。実状から乖離していた断路器の定格ループ電流の上限値撤廃に成功し、UHV断路器、接地開閉器の電流開閉責務を国内機器の仕様値に近い値に規格化すると共に、国内開発された抵抗付き断路器の規格化に成功した。以上の活動により、IEC規格の内容を引き上げ国内規格に近づけることにも寄与した。

谷川 庄二（株式会社フジクラ）

IEC/TC 86(ファイバオプティクス)において、SC 86A/WG 1（光ファイバ）、SC 86A/WG 3(光ケーブル)の国際・国内委員として、光ファイバ及び光ケーブルの測定・試験方法、製品規格の標準規格化などに貢献した。

塚越 宏之（株式会社UL Japan）

IEC/TC 66において、絶縁協調および安全の専門家として、TC 66国内委員への啓蒙、TC 66で活動中の製品に固有な安全確立及び日本意見展開において尽力した。計測、制御及び研究用機器を扱うTC 66は幅広い産業分野への影響があり、多大な貢献を行った。

松山 英也（株式会社ソシオネクスト）

IEC/TC 47(半導体デバイス)において、WG 5プロジェクトリーダ及び国内委員会(JEITA故障メカニズムPG)主査として、7件の半導体デバイス試験方法に関するIEC基準を作成。日本のこの分野における規準作成の地位を高め、日本がFoundryを安心して使えるための信頼性基準の作成に貢献した。